

性能及测试方法

■性能及测试方法

项目		性能	性能及测试方法及条件 (根据JIS C 5101-1)				
		X5R 特性					
静电容量		允许差以内	<table border="1"> <tr> <td>测定周波数</td> <td>测定电压</td> </tr> <tr> <td>1kHz±10%</td> <td>1.0V±10%</td> </tr> </table>	测定周波数	测定电压	1kHz±10%	1.0V±10%
测定周波数	测定电压						
1kHz±10%	1.0V±10%						
介电损耗因数		2.5%以下	测量前进行热处理				
耐电压		无绝缘击穿，无破损	施加电压 : 1~5秒間 在硅油中施加电压 充放电电流 : 50mA以下 施加电压 : 额定电压×250%				
绝缘阻抗		10,000MΩ以上	施加电压 : 额定电压 施加时间 : 1分钟				
粘附强度	引线接合	0.03N以上	用Φ25μ的Au线进行引线接合贴装后，再测量引线的强度				
温度循环	外观	无明显机械损伤	常温→最低使用温度→常温→最高使用温度 3分钟 → 30分钟 → 3分钟 → 30分钟 依次将电容置于上述1~4个阶段中为一个循环 此操作进行二十五个循环				
	静电容量变化率	±7.5%以下					
	Q及介电损耗因数	满足初始值					
	绝缘阻抗	满足初始值					
耐湿负荷	外观	无明显机械损伤	测试前进行电压处理 测试温度: 85±2℃ 相对湿度: 85±3%RH 测试电压: 3.0 测试時間: 240-0, +24小时				
	静电容量变化率	±12.5%以下					
	Q及介电损耗因数	初始值的2倍以下					
	绝缘阻抗	1,000MΩ以上					
高温负荷	外观	无明显机械损伤	测试前进行电压处理 测试温度: 125±3℃ 相对湿度: 额定电压 测试时间: 2000-0, +48小时				
	静电容量变化率	±12.5%以下					
	Q及介电损耗因数	初始值的2倍以下					
	绝缘阻抗	1,000MΩ以上					

注1：热处理需要在150+0/-10℃、1小时后，从室温中取出，放置48±4个小时。

注2：电压处理要在规定的试验条件下进行，1小时处理后，从室温中取出放置48±4个小时。